

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

## «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	<u>Информа</u>	тика и системы управлен	ния
КАФЕДРА <u>Про</u>	ектирование и техн	нология производства эл	ектронной аппаратуры
ОТЧЕТ П	<u>О ПРОИЗВО</u>	<u>ОДСТВЕННОЙ</u>	ПРАКТИКЕ
Студент		Валентин Сергеевич	
	фамил	ия, имя, отчество	
Группа <u>ИУ4-73</u>	ВБ		
Тип практики п	роизводственная	я, конструкторско-тех	кнологическая
Название предприя	ТИЯ	ООО «НТЦ "Вулка	ьн <b>"</b> »
Студент			Круглов В.С.
		подпись, дата	фамилия, и.о.
Руководитель прак	гики		Селиванов К.В.
		подпись, дата	фамилия, и.о.
Оценка			

#### Индивидуальное задание

Во время прохождения практики студент должен:

- 1. Собрать общую информацию о предприятии (название, сфера деятельности, исторические данные и.т.д).
- 2. Выполнить обзор выпускаемой на предприятии продукции (только информация, представленная в открытом доступе).
- 3. Подготовить общую характеристику отдела, в который студент распределен на практику (обзор решаемых задач, взаимодействие с другими подразделениями и др.).
- 4. Ознакомиться с работой инженера конструктора электронных средств.
- 5. Ознакомиться с работой инженера— технолога электронной аппаратуры.
- 6. Разработать технологию производства и сборки электронного устройства.
- 7. Подготовить отчет по практики.

## Оглавление

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
Введение	5
1. Основная часть	6
1.1. История ООО «НТЦ "Вулкан"»	6
1.2. О предприятии и научной деятельности	7
1.3. Общая характеристика отдела технологии	8
1.4. Уровень миниатюризации разработок отдела	10
1.5. Обзор АСУ и САПР	11
1.6. Практика на предприятии	12
2. Описание разрабатываемого устройства «УМЗЧ на биполярах»	14
3. Приложения	16
3.1. Приложение 1 – Основание корпуса (чертеж детали)	16
3.2. Приложение 2 – Крышка корпуса (чертеж детали)	17
3.3. Приложение 3 – Корпус в сборе (СБ)	18
3.4. Приложение 4 – Спецификация к СБ Корпус в сборе	19
3.5. Приложение 5 – Схема электрическая принципиальная (Э3)	20
3.6. Приложение 6 – Перечень элементов (ПЭ3)	21
3.7. Приложение 7 – Сборочный чертеж электронной ячейки (СБ)	22
3.8. Приложение 8 – Спецификация к СБ электронной ячейки	23
3.9. Приложение 9 – Плата печатная	24
3.4. Приложение 10 – Прибор в сборе (СБ)	25
3.5. Приложение 11 – Спецификация прибора в сборе	26
4. РТ32 Прототип оснастки	27
Заключение	28
Использованная литература	2.9

#### ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АСУ – автоматизированная система управления

ГОСТ – государственный стандарт

ГИС – гибридная интегральная микросхема

ЕСКД – единая система конструкторской документации

ЕСТД – единая система технологической документации

КД – конструкторская документация

НИР – научно-исследовательская работа

НЧ – низкая частота

ОКР – опытно-конструкторская работа

ОП – опытное производство

ПК – персональный компьютер

ПО – программное обеспечение

РЭБ – радиоэлектронная борьба

РЭС – радиоэлектронные средства

САПР – система автоматизированного проектирования

СВЧ – сверхвысокая частота

СМК – система менеджмента качества

СРГ – соединитель радиочастотный герметичный

ТБ – техническое бюро

ТД – технологическая документация

ТЗ – техническое задание

ТНК – технико-нормировочная карта

ТУ – технические условия

SMD – surface mounted device

#### Введение

Производственная практика проводилась в ООО «НТЦ "Вулкан"», ТБ подразделения (технология изготовления микроэлектроники). Главной целью данной практики являлось ознакомление с будущей специальностью на примере работы конструкторских и технологических отделов предприятия.

Задачи информации практики: изучение предприятии  $\mathbf{o}$ деятельности (история, направления И т.д.), составить общую характеристику отдела, в котором проходила практика, ознакомиться работой инженера-конструктора инженера-технолога, И разработать технологию сборки электронного изделия.

#### 1. Основная часть

#### 1.1. История ООО «НТЦ "Вулкан"»

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга» был основан в 1943 году как ведущий институт по радиолокации. Под руководством первого директора — академика А. И. Берга во ВНИИ-108 (первое название предприятия) были проведены фундаментальные и прикладные исследования в области радиолокации, которые легли в основу таких ее направлений, как радиоэлектронная борьба, авиационное и космическое радиоэлектронное наблюдение, создание радиоэлектронных систем ПВО, радиопротиводействие средствам радиоэлектронного наблюдения и т.д.

На базе подразделений ЦНИРТИ были сформированы такие предприятия, как «НИИДАР», НПО «Полюс», «КНИРТИ», «МЗРТА» и «КЗРТА». [1]

В настоящее время АО «ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга» является головным предприятием по разработке космических и авиационных комплексов дистанционного зондирования Земли, ведущим предприятием по разработке конкурентоспособной наукоемкой гражданской продукции.

АО «ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга», наряду с другими крупными предприятиями отрасли, входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В декабре 2008 года правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики включила АО «ЦНИРТИ им. академика А. И. перечень 295 системообразующих организаций, стратегическое значение. На предприятии имеются все условия для научного роста специалистов. Специализированный ученый совет по специальностям "Радиолокация "Радиофизика" И навигация" является одним авторитетнейших советов страны. Разработки ЦНИРТИ имеют высокий экспортный потенциал, что подтверждается постоянно расширяющимся сотрудничеством с зарубежными заказчиками. [1]

#### 1.2. О предприятии и научной деятельности

В настоящее время ЦНИРТИ выполняет функции базового предприятия, в том числе и научная деятельность института ведется по следующим научнотехническим направлениям:

- Космические и авиационные системы дистанционного зондирования Земли;
- Авиационные комплексы и средства РЭБ для защиты малоразмерных летательных аппаратов;
- Комплексы по защите баллистических объектов;
- Широкополосные усилители мощности СВЧ диапазона;
- Специальная аппаратура антитеррористического назначения;
- Моделирование и радиомониторинг окружающего пространства;
- Микроэлектронное приборостроение;
- Базовые технологии и элементы радиоэлектронных средств и комплексов радиоэлектронного противодействия различного базирования;

На базе ЦНИРТИ функционирует Научно-технический совет, Учёный совет (совместный с МГТУ МАИ), аспирантура, базовые кафедры МАИ и МИРЭА. Сотрудники института регулярно становятся участниками научных конференций, семинаров, круглых столов, публикуют свои статьи в авторитетных научных изданиях.

Разработка базовых элементов нового поколения, в том числе сверхширокополосной цифровой радиочастотной памяти, позволяет создавать перспективные средства РЭБ для самолетов 5-го поколения.

Научно-практические достижения ЦНИРТИ в области нелинейной радиолокации сегодня широко используются в серии поисковой аппаратуры и других образцах спецтехники. Цифровые технологии обеспечивают разработку высокоэффективной аппаратуры радиоэлектронного подавления радиолиний управления взрывом.

Сегодня в ЦНИРТИ уделяется большое внимание математическому и физико-математическому моделированию радиоэлектронных комплексов и

средств. На предприятии имеется уникальный комплекс, который обеспечивает в диапазоне 0.05-18 ГГц многоканальное воспроизведение сигналов с высокой точностью и в реальном масштабе времени, что позволяет исследовать весь спектр современных и перспективных радиоэлектронных систем, в том числе и когерентных.

Новейшие технические решения применяются также для разработки и производства гражданской продукции: аппаратуры радиочастотной идентификации нового поколения, безэховых камер, приборов автоматического распознавания патогенных микроорганизмов, гибридно-интегральных усилителей мощности, квазимонолитных и монолитных СВЧ устройств, уникальных СВЧ диплексеров и мультиплексеров. Актуальны и востребованы работы в области энергосбережения - создание и внедрение комплексов для автоматизированного коммерческого и технического учета электроэнергии и разработке энергосберегающего осветительного оборудования.

Действующая на предприятии система менеджмента качества (СМК) сертифицирована в системе сертификации "Военный регистр" на соответствие требованиям стандартов СРПП ВТ, ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001. [2]

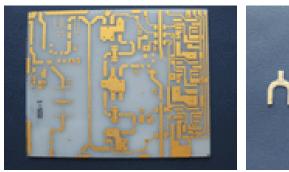
На предприятии имеются все условия для научного роста специалистов. Специализированный ученый совет по специальностям "Радиофизика" и "Радиолокация и навигация" является одним из авторитетнейших советов страны.

Разработки ЦНИРТИ имеют высокий экспортный потенциал, что подтверждается постоянно расширяющимся сотрудничеством с зарубежными заказчиками.

#### 1.3. Общая характеристика отдела технологии

Практика проводилась в ТБ подразделения, который занимается технологией изготовления СВЧ твердотельных модулей, используемые институтом на лабораторно-производственном участке:

1. Тонкопленочная технология изготовления керамических микрополосковых плат на подложках из поликора, 22ХС. Используется структура металлизации хром-медь-никель-золото с общей толщиной до 8 мкм. На платах реализуются элементы топологии с минимальными размерами 25 0.2 мкм. металлизированные отверстия c диаметром MM. неметаллизированные отверстия произвольной формы и размеров, пленочные резисторы из сплава РС3710 с сопротивлением 50 и 100 Ом/кв. Обрабатываются подложки толщиной от 0.25 до 1 мм. Технология используется для создания активных и пассивных устройств в диапазоне до 18 ГГц. Пример выполнения данной технологии предоставлен на рисунке 1 и 2.

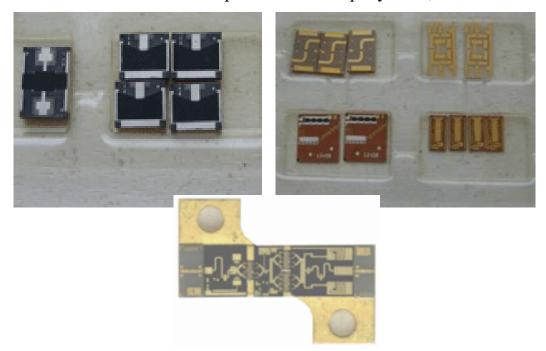




Рисунки 1,2 – Керамические микрополосковые платы на подложках из поликора

2. Толстопленочная технология СВЧ и НЧ керамических плат на подложках из поликора, 22ХС, кварцевого и кремниевого стекла, керамик с высокой диэлектрической проницаемостью (20-100) и нитрида алюминия. Используются серебросодержащие пасты отечественного производства с толщиной металлизации 16-20 мкм. На платах реализуются элементы топологии с минимальными размерами 70 мкм, металлизированные отверстия с диаметром 0.2 металлизированные торцы MM, плат, неметаллизированные металлизированые отверстия произвольной формы и размеров, толстопленочные резисторы с сопротивлением 1-10000 Ом. Обрабатываются подложки толщиной от 0.25 до 1 мм, для коммутационных плат реализуется до 7 слоев металлизации, кроме того, технология позволяет изготавливать многослойные платы на основе керамики низкотемпературного обжига (LTCC) с числом слоев до 20-и

металлизированными отверстиями диаметром 0,1 мм. Технология используется для создания пассивных СВЧ устройств в диапазоне частот до 18 ГГц. Пример выполнения данной технологии предоставлен на рисунке 3, 4 и 5.



Рисунки 3,4,5 - керамические платы НЧ и СВЧ на подложках из поликора

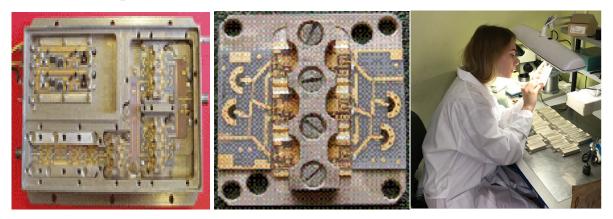
3. Технология сборки гибридно-интегральных схем с использованием кристаллов дискретных полупроводниковых приборов и МИС. Используются методы установки кристаллов на платы и основания приклеиванием токопроводящими клеями и эвтектической пайкой припоями золото-олово. Присоединение проволочных выводов диаметрами от 15 до 50 мкм к микросхемам и полупроводниковым приборам выполняется методами термокомпрессионной, термозвуковой (для кристаллов из арсенида галлия), ультразвуковой (для кремниевых ИС) и односторонней контактной сварки (для керамических плат). [3]

#### 1.4. Уровень миниатюризации разработок отдела

Технический уровень разработок отдела в области создания комплексированных СВЧ модулей:

1. Разработка гибридно-интегральных, квазимонолитных и монолитных СВЧ устройств и элементов для усилителей мощности, гетеродинных и других устройств аппаратуры РЭБ. Освоена разработка необходимой элементной базы

в диапазонах частот 1-2, 2-4, 2-6, 4-8, 8-12, 4-12, 8-18 ГГц, осваиваются устройства диапазонов 18-26, 26-40 ГГц. Технический и технологический уровень разработок ГИС находится на уровне ведущих предприятий электронной промышленности России. Пример выполнения модулей предоставлен на рисунках 6, 7 и 8.



Рисунки 6-8 - Гибридно-интегральные СВЧ модуль и узел

- 2. Создание толстопленочных и объемных интегральных схем СВЧ диапазона.
- 3. Разработка и внедрение многоканальных интегрированных приемнопеленгационных устройств на основе ФАР. [3]

## 1.5. Обзор АСУ и САПР

На предприятии в основном используется программное обеспечение Search от разработчиков «Intermech».

Search предназначен для автоматизации рабочего места конструктора на машиностроительных и приборостроительных предприятиях, предназначенную для решения следующих задач:

- Управления данными об изделиях;
- Управления жизненным циклом изделия;
- Ведения электронного архива технической документации;
- Управления документооборотом предприятия;
- Управления проектами.
   Интерфейс программы представлен на рисунке 9.

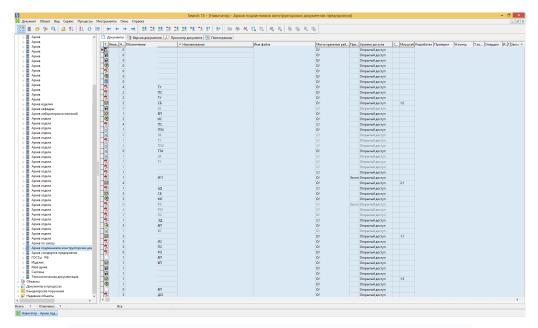


Рисунок 9 – Интерфейс Search в открытом режиме

Также для решения конструкторских задач, на предприятии используется программный комплекс CAПР SolidWorks для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Программа обеспечивает разработку изделий любой степени сложности и назначения. Решаемые задачи:

- Конструкторская подготовка производства;
- Технологическая подготовка производства;
- Управление данными и процессами;

Помимо SolidWorks, на предприятии используется Autodesk AutoCAD для решения аналогичных задач.

Аналоги SolidWorks и Autodesk AutoCAD являются: Компас-3D, Autodesk Inventor, NaroCAD, ANSYS SpaceClaim.

#### 1.6. Практика на предприятии

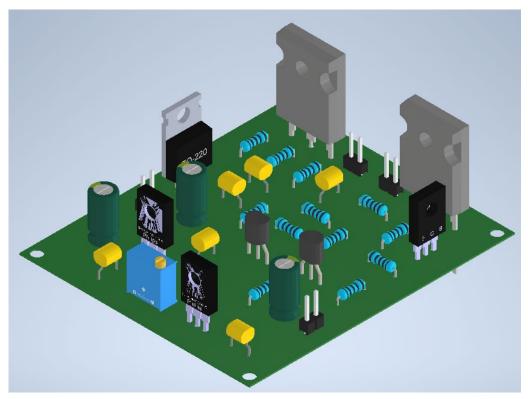
В ходе производственной практики были проведены следующие мероприятия:

- 1. Организационное собрание;
- 2. Инструктаж по технике безопасности;

- 3. Подготовка доклада на тему: «Поликор» и обсуждение материалов, используемых в СВЧ технике, основы СВЧ. Знакомство с настройкой узлов, модулей;
- 4. Знакомство с производством, ознакомление с оборудованием, используемым на территории института;
- 5. Просмотр документальных фильмов о ЦНИРТИ, изучение исторических предпосылок и проектов;
- 6. Посещение «тонких плёнок». Изучение устройства установок микросварки (контактная, термокомпрессионная, ультразвуковая) по книге О.С.Морякова «Сборка» и технической документации;
- 7. Проверка технологической документации. Основные заполнения ТНК;
- 8. Сборка СВЧ модулей. Установка узлов в корпус;
- 9. Работа на участке герметизации. Установка СРГ, лужение крышек, зенковка отверстий, проверка герметичности;
- 10. Маркировка антистатических браслетов. Подготовка журнала контроля сопротивления антистатики браслетов и обуви.

#### 2. Описание разрабатываемого устройства «УМЗЧ на биполярах»

УСЗЧ на биполярах является недорогим, простым и мощным устройством. При напряжении питания  $\pm 30$  В, схема выдает около 60 Вт на канал, что показывает свою надёжность и стабильность, простоту, дешевизну в изготовлении и качественными показателями. Устройство в сборе предоставлено на рисунке 10.



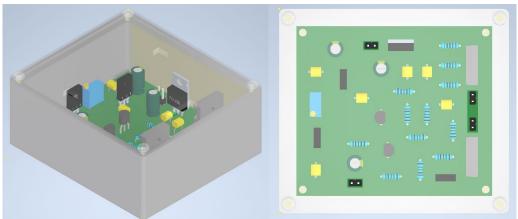


Рисунок 10 – УМЗЧ на биполярах в сборе

#### Технические характеристики:

Номинальная  $P_{\text{вых}}$ : 95 Вт,  $R_{\text{H}} = 4$  Ом;

 $U_{\text{пит}}: \pm 35 \text{ B};$ 

Диапазон частот (-3 дБ): 10 Гц...27 кГц;

АЧХ 20 Гц - 20 кГц: 0,4 dB;
Входная чувствительность: 1 В;
ТНО при Р<sub>вых</sub>=95 Вт:
1 кГц - 0,1%;

20 кГц - 0,35%

#### Принцип работы:

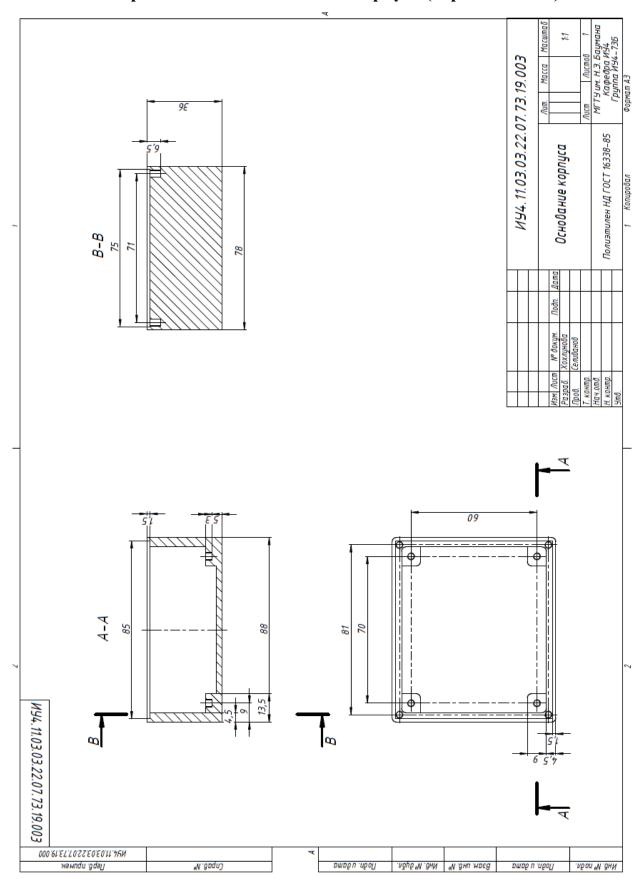
Дифференциальный каскад выполнен на двух транзисторах структуры PNP - VT1, VT2. За ООС и общее усиление схемы отвечает цепь на R5C2 и R6. По напряжению сигнал усиливается транзистором VT4 и подаётся на усилитель мощности (тока) VT5, VT7 и VT6, VT8.

Выбор в качестве VT4 был выбран MJE15032G поскольку он обусловлен хорошими характеристиками на ВЧ. Характерной особенностью такого включения выходного каскада, является малый ток покоя 50-60 мА. Для термостабилизации используется транзистор VT3 в диодном включении.

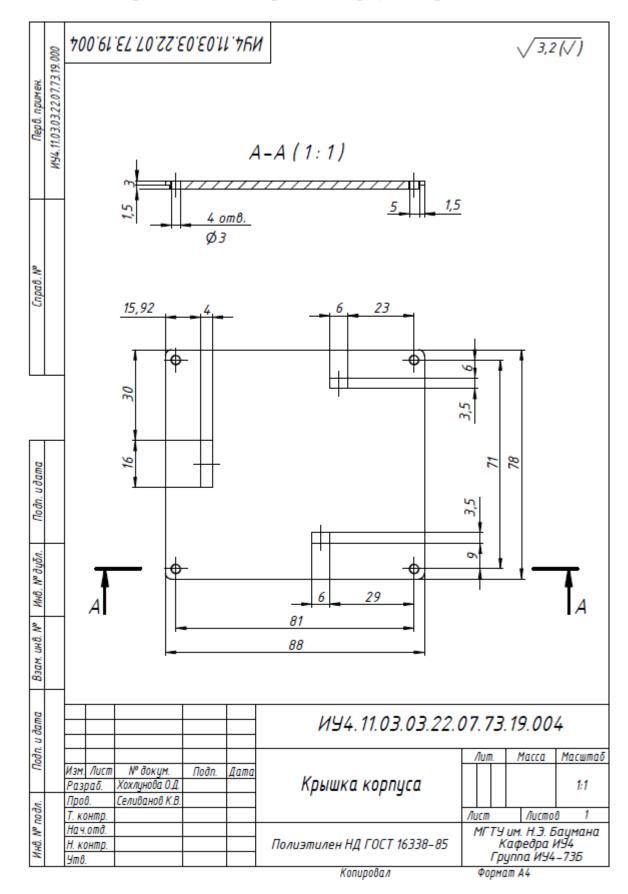
Конденсаторы С3 и С4 предотвращают самовозбуждение усилителя по ВЧ.

## 3. Приложения

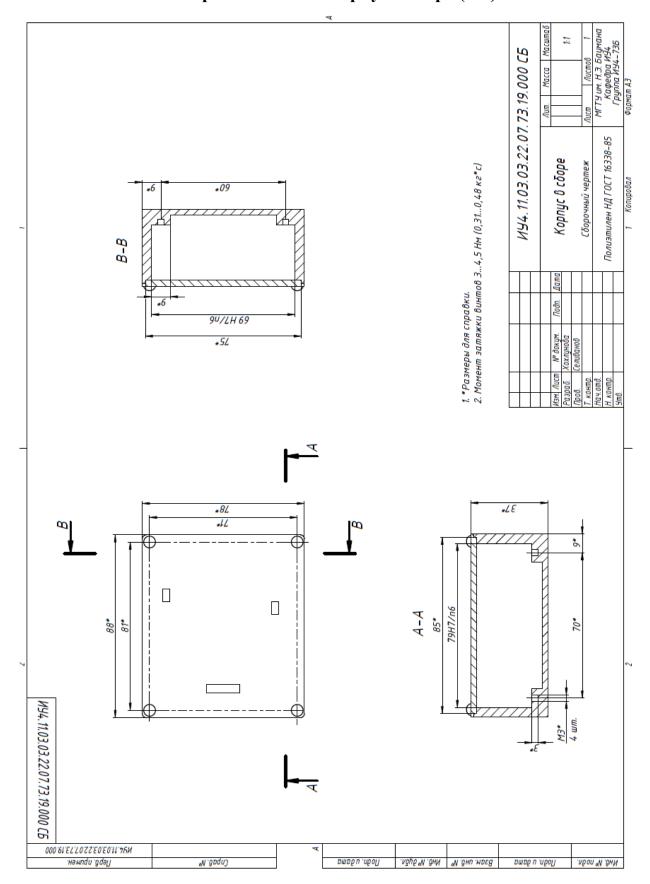
## 3.1. Приложение 1 – Основание корпуса (чертеж детали)



## 3.2. Приложение 2 – Крышка корпуса (чертеж детали)



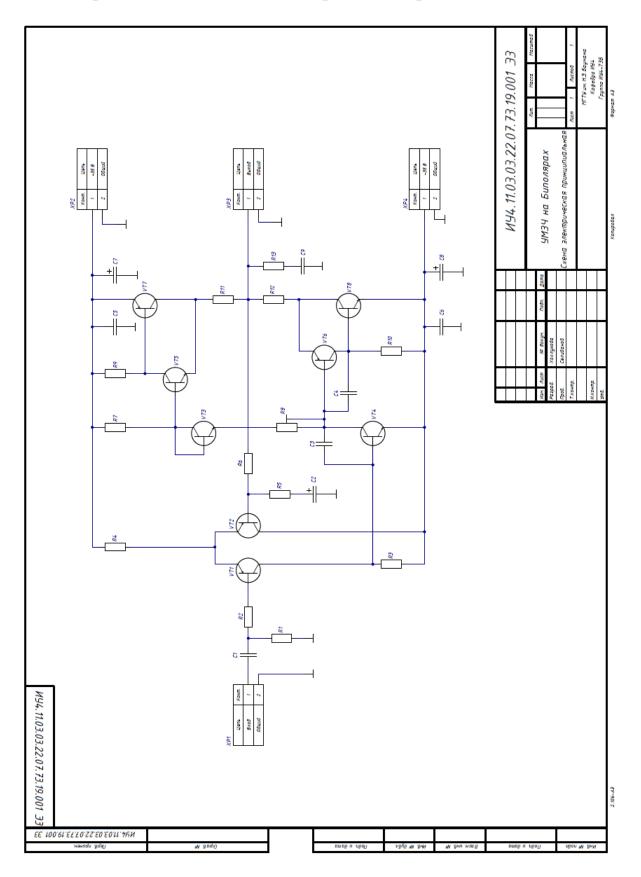
## 3.3. Приложение 3 – Корпус в сборе (СБ)



## 3.4. Приложение 4 – Спецификация корпуса в сборе

eH.	Формат	Зона	Поз.		Обозн	ачени	е		Наименован	iue	Кол.	Приме- чание
Перв. примен.									<u>Документац</u>	<u>ия</u>		
Ш	A3			ИУ4.11.03.	03.22.07	7.73.19.0	000 СБ		Сборочный чертёж		1	
									Детали			
Q.			_									
Справ. №	A3		2	ИУ4.11.03. ИУ4.11.03.					Основание корпуса Крышка корпуса		1	
S	A4			N34.11.03.	<i>03.22.07.</i>	13.19.0	U4		прышка корпуса			
Ш									Стандартные из	делия		
Ш												
ш			3						Винт МЗ-6дх6 ГОСТ 17	473-80	8	
na												
Подп. и дата												
Подп.												
yōn.												
Инв. № дубл.												
AN MA												
<b>№</b>											$\vdash$	
Взам. имв. №												
Вза												
П	$\vdash$	Н										
дата												
Подп. и дата		Ш	$\top$									
Not		Лис		№ докум.	Подп.	Дата	И	14.	11.03.03.22.			
подл.	Раз Про	θ.	Се	хлунова ливанов				Корпус в сборе		Листов 1		
Инв. № подл.	Нач.отд. МГТУ им. Н.З. Б Н. контр. Спецификация Кафедра И			ИУ4								
Ш	Утв	L			<u> </u>				Копировал	Формат		

## 3.5. Приложение 5 – Схема электрическая принципиальная (Э3)



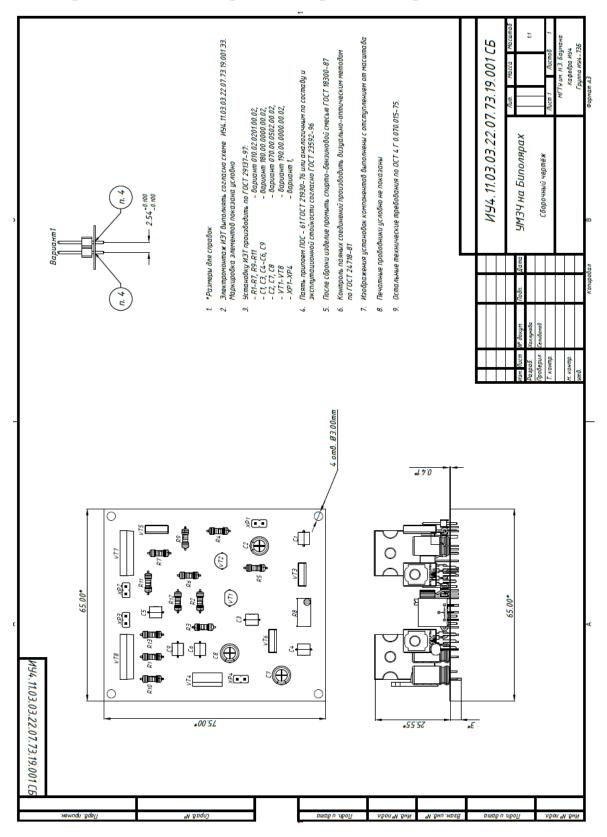
## 3.6. Приложение 6 – Перечень элементов (ПЭ3)

	11.03.03.22.07.73.19.001	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
34	.73.1		Конденсаторы						
намифи	22.07	<i>C1</i>	K10-17Б-25B-1 мкФ ± 20% (Ether Components, Kumaū)	1					
Nepô. 1	.03.2	С2	ECAP(K50-35) -63B- 22 мкФ ± 20% (ECPOS, Германия)	1					
"	11.03	<i>C3, C4</i>	K10-176-25B-47 мκΦ ± 20% (Ether Components, Kumaū)	2					
	ИЗ4.	C5, C6, C8	K10-175-25B-0,1 мкΦ ± 20% (Ether Components, Kumaū)	3					
	7	<i>C7, C9</i>	ECAP(K50–35) –63B– 470 мкФ ± 20% (ECPOS, Германия)	2					
			<u>Резисторы</u>						
3 1/2		R1, R2	CF-100 - 2 - 2,2 кОм ± 5% (Тайвань)	2					
Cnpad		R3	CF-100 - 2 - 560 Ом ± 5% (Тайвань)	1					
		R4	CF-100 - 2 - 18 кОм ± 5% (Тайвань)	1					
		R5	CF-100 - 2 - 1 кОм ± 5% (Тайвань)	1					
		R6	CF-100 - 2 - 27 кОм ± 5% (Тайвань)	1					
		R7	CF-100 - 2 - 4,7 кОм ± 5% (Тайвань)	1					
		R8	CF-100 - 2 - 100 Ом ± 5% (Тайвань)	1					
_		R9, R10	CF-100 - 2 - 220 Ом ± 5% (Тайвань)	2					
0		R11, R12	CF-100 - 2 - 0,1 Ом ± 5% (Тайвань)	2					
Подп. и дата		R13	CF-100 - 2 - 10 Ом ± 5% (Тайвань)	1					
ogu. r									
_			<u>Транзисторы</u>						
ōā.		VT1, VT2	2N5401 (ON Semiconductor, Kumaū)	2					
MAG. Nº CLUÓN.		VT3, VT5	BD139G (ON Semiconductor, Kumaū)	1					
MAG		VT4	MJE15032G (ON Semiconductor, Kumaū)	1					
No.		VT6	BD140G (ON Semiconductor, Kumaū)	1					
UHD.		VT7	TIP36CG (ON Semiconductor, Kumaū)	1					
Взам.		VT8	TIP35CG (ON Semiconductor, Kumaū)	1					
β									
DW		XP1-XP4	Вилка штыревая PLS-2 (Zhenqin, Kumaū)	4					
u da									
Подп. и дата		Изм Лист	N° докум. Подпись Дата ИУ4.11.03.03.22.07.	<i>73.</i>	19.001 ПЭ 3				
NO.		Разраб. Х	охлунова	/	Пит. Лист Листов				
Инд. № подл.		Пров. С	еливанов ЭПЗЧ На Биполярах		1 1 МГТУ им. Н.Э. Баумана				
MHB		Н.контр. Утвердил	Перечень элементов		Кафедра ИУ4 Группа ИУ4—73Б				
		этоероил	Konunahaa		Формат 44				

Копировал

Формат А4

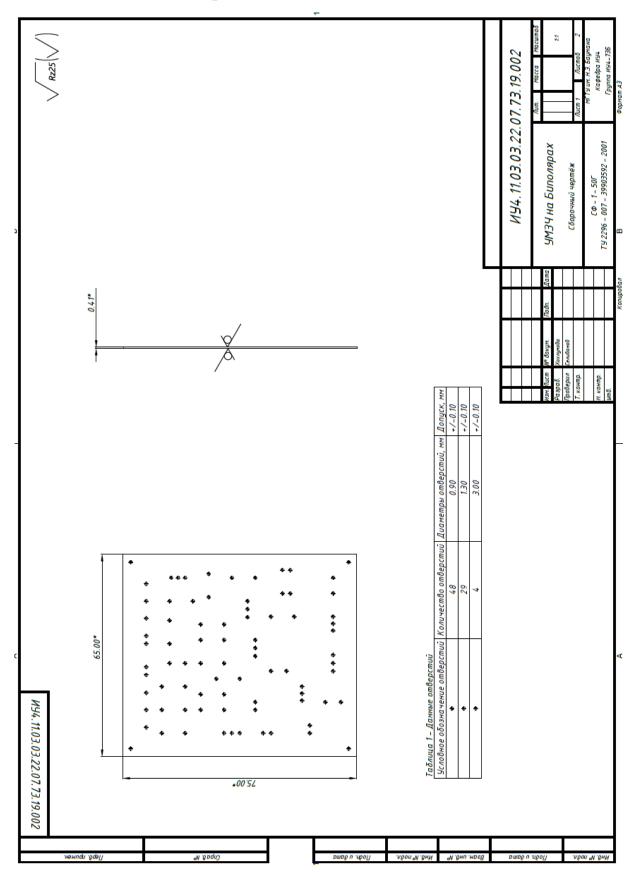
## 3.7. Приложение 7 – Сборочный чертеж электронной ячейки (СБ)



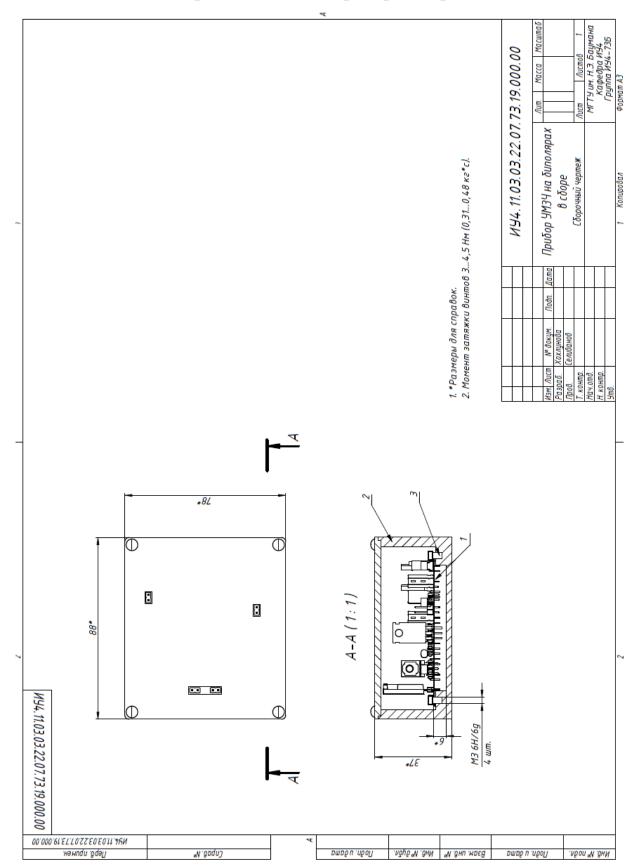
## 3.8. Приложение 8 – Спецификация к СБ электронной ячейки

		Формат	Зона	Поз.		Обозн	пчеши	2	Наименован		Кол.	Приме-	
te H.		30			obosna iznoz				пиименовиние		NU/I.	чание	
Перв. примен.									Документаци	Я			
Лер		A3			ИУ4.11.03	.03.22.07	07.73.19.001 СБ Сборочный чертёж		1				
		A3			ИУ4.11.03.	03.22.07	73.19.0	01 33	Схема электрическая		1		
									принципиальная				
Н		A4			ИУ4.11.03.	03.22.07	73.19.0	01 ПЭ 3	Перечень злементов		1		
									<u>Детали</u>				
Справ.№		A3			ИУ4.11.03.	03.22.07.	.73.19.0	02	Плата печатная		1		
Cnp									Прочие издели	JЯ			
				1					Вилка штыревая PLS-2	?	4	XP1-XP4	
ш									(Zhenqin, Kumaū)				
_									Конденсатор	Ы			
				2					K10-17Б-25B-1 мкФ ± 20	%	1	<i>C1</i>	
Подп. и дата									(Ether Components, Kumaū)				
dn. u				3					ECAP(K50-35) -63B- 22 MKΦ ± 20%		1	C2	
N									(ECPOS, Германия)				
.Si				4					K10-17Б-25B-47 мкΦ±	20%	2	<i>C3, C</i> 4	
δηδ									(Ether Components, Kumaū)				
Инв. № дубл.				5					K10-17Б-25B-0,1 мкΦ±2	20%	1	C5, C6, C8	
$\vdash$		Г							(Ether Components, Kur	naū)			
MB. A				6					ECAP(K50-35) -63B- 470 mkΦ ± 20%		2	<i>C7, C9</i>	
Взам. инв. №									(ECPOS, Германия)				
H													
ıma									<u>Резисторы</u>	!			
Подп. и дата				7					CF-100 - 2 - 2,2 k0m ± 5%	(Тайвань)	2	R1, R2	
Подп			0	_	10 30	- Codo		ИУ4.	.11.03.03.22.07.73.19.00				
ди.		_	Лис раб. в	Χt	№ докум. эхлунова ливанов	Подп.	Дата	имэн	Num. Nucm		Листов 2		
Инв. № подл.		Нач	.отд.		navanvu			דכויוכ	на Биполярах			Баумана	
MMB.		Н. к Утв	онтр ).						Спецификация Кафедра ИЗ Группа ИУ4—		ИУ4		
_	Копировал Формат А4												

## 3.9. Приложение 9 – Плата печатная



## 3.10. Приложение 10 – Прибор в сборе (СБ)



## 3.11. Приложение 11 – Спецификация прибора в сборе

_												
Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.		Оδозн	ачени	le	Наименован	iue	Кол.	Приме- чание
рв. пр												
Леў									<u>Д</u> окументац	<u>ия</u>		
		A3			ИУ4.11.03	.03.22.07	7.73.19.	000.00 СБ	Сборочный чертёж		1	
П												
									<u>Детали</u>			
Справ. №		A3		1	ИУ4.11.03	.03.22.07	73.19.0	001	УМЗЧ на биполярах эле	ктронная	1	
Cub				_					ячейка		_	
		A3		2	ИУ4.11.03.	.03.22.07	73.19.0	700	Корпус в сборе		1	
									5 3	2	-	
Ш	_								<u>Стандартные из</u>	<u>делия</u>	_	
				_					0 42 4 5057 47	/ = 2 .00		
				3					Винт М3-6дх4 ГОСТ 17	473-80	4	
П	$\dashv$											
DW.												
Подп. и дата												
Nogu											_	
											_	
Jon.											_	
Инв. № дубл.												
MAB												
2												
Взам. инв. №												
Взам												
H												
DWI												
Подп. и дата												
Подп				$\perp$			$oxed{-}$	ИЧ/. 1	1.03.03.22.07	7 7 3 10	9 01	0000
Ц			Лис		№ докум.	Подп.	Дата	7134.1	1.03.03.22.01			
ogu.		Раз Про			хлунова ливанов		$\vdash$	При	бор УМЗЧ на	/lum.	Лист 1	Листов 1
Инв. № подл.		Нач	.omð						лярах в сборе	MITTY	им. Н.Э.	Баумана
MHB		Η. κι У <i>т</i> в	онтр ).	-		Καφεθρα И94 Γημηνικαμία Γρίπα 194-735				И94 14-73Б		
ш	Копировал Формат А4											

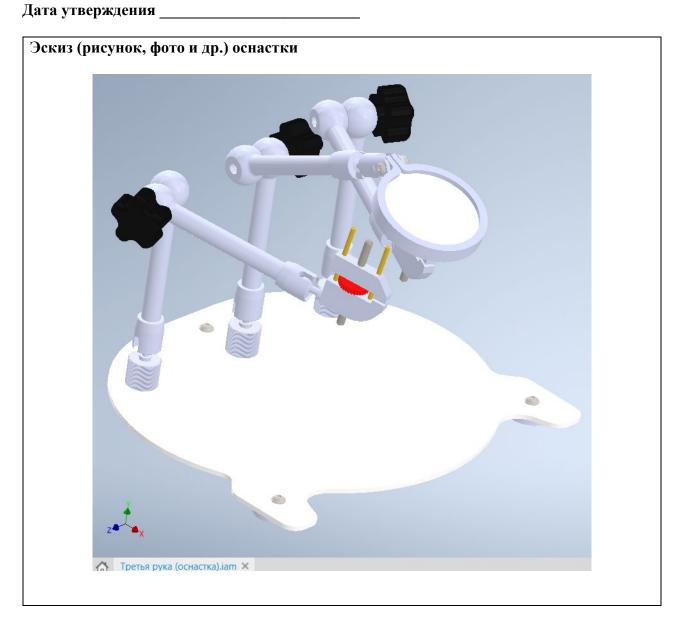
26

## 4. РТ32 Прототип оснастки

## РТЗ 2 Прототип оснастки

## Техническое задание на проектирование оснастки технологической

Студент: Хохлунова Ольга Дмитриевна
ГруппаИУ4-73Б
<b>Тема КР</b> Разработка технологического процесса сборки устройства «УМЗЧ н
биполярах»
Название операции,
для выполнения которой
проектируется оснастка: _Сборка электронной ячейки
Название оснастки Третья рука



Руководитель КР

#### Заключение

В ходе прохождения производственной практики на АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» были получены теоретические знания и сведения в области технологии микроэлектроники, реализованы навыки ведения самостоятельной работы и значительно расширены профессиональные умения, необходимые инженеру.

В период производственной практики, которая проходила с 1 по 27 июля, был изучен раздел "Характеристика предприятия" - ознакомление со структурой управления предприятия, правилами внутреннего трудового распорядка, охраной труда при эксплуатации электроустановок и должностными обязанностями технологов, инженеров и монтажников.

В ходе практических занятий производились электромонтажные работы, при выполнении которых был получен опыт с устройством ряда инструментов, приспособлений, оборудования, устройств и аппаратов, эксплуатируемых на предприятии.

Так же было изучен и проработан материал для выполнения индивидуального задания, что выполнено в полном объеме.

#### Использованная литература

- 1) История ЦНИРТИ. [Электронный ресурс] URL: http://xn--h1aannku.xn--p1ai/ (дата обращения 15.07.2021)
- 2) О предприятии. [Электронный ресурс] URL: http://xn--h1aannku.xn--p1ai/about/ (дата обращения 15.07.2021)
- 3) СВЧ разработки. [Электронный ресурс] URL: http://xn--h1aannku.xn--p1ai/catalog/svch/ (дата обращения 16.07.2021)
- 4) ГОСТ 3.1118-82. [Электронный ресурс] URL: https://docs.cntd.ru/document/1200012112 (дата обращения 16.07.2021)
- 5) Микроскоп MБС-10. [Электронный ресурс] URL: https://www.nv-lab.ru/catalog info.php?ID=4794&Full=1 (дата обращения 17.07.2021)
- 6) Оптический контроль печатных плат. [Электронный ресурс] URL: https://teche.ru/opticheskij-kontrol.php (дата обращения 17.07.2021)